朝陽科技大學 098學年度第2學期教學大綱
IC Test System 積體電路測試系統

當期課號	2849	Course Number	2849
授課教師	陳宏達	Instructor	CHEN,HON DA
中文課名	積體電路測試系統	Course Name	IC Test System
開課單位	資訊工程系(四日)四A	Department	
修習別	選修	Required/Elective	Elective
學分數	3	Credits	3
課程目標	本課程的主要目的要讓學習者瞭解積體電路測試設備的特性與種類、基本操作原理，包含以下內容：測試系統簡介、基本測試電路、測試機結構及商用測試系統、分類機、針測機與測試治具介紹。	Objectives	Course objective is to provide students with a comprehensive understanding of IC test equipments. The course outline is as follows: test system introduction, basic test circuits, tester architecture, commercial tester, handlers, probers, and test tools.
教材	自編教材	Teaching Materials	Lecture
成績評量方式	1. 原則：考試或校外實習 60%、 (含學習態度、作業、小考、專題報告)40%	Grading	exam. or exercise : 60% learning attitude, homework, quiz, report..): 40%
教師網頁	http://ictest.csie.cyut.edu.tw		
教學內容	1. 測試系統簡介 2. 基本測試電路 3. 類比IC測試機結構及商用測試系統 4. 數位IC測試機結構及商用測試系統 5. 記憶體IC測試機結構及商用測試系統 6. 混合訊號IC測試機結構及商用測試系統 7. 分類機、針測機與測試治具(業界師資6 hrs 8. 測試治具診斷及常見的問題 9. 測試介面電路設計 (測試成載板與探針卡 10. 測試治具訂製前文件準備及規劃(案例演練) 11. 高頻介面電路設計及高頻測試概念(校外師資6hrs) 12.　參訪測試設備商(分類機、針測機、測試治具、業界師資6hrs) 校外參訪實習(98學年度必須同時積體電路測試系統或該天無其他課程者始有資格，並有修過積體電路測試概論具優先資格)	Syllabus	Introduction to ATE Basic Test Circuit Structure of Analog Tester and Commercial Testers Structure of Digital Test er and Commercial Testers Structure of Memory Test er and Commercial Testers Structure of Mixed-Signal Test er and Commercial Testers Introduction to Handler, Prober and Test Fixture Diagnostics and troubling of Test Fixture Test Interface Circuit Preparations of Test Fixtures Concepts of High Frequency Circuit design and test Experiment

尊重智慧財產權，請勿非法影印。